タンパク質結晶の X 線トポグラフィにおける転位像の解析

横市大院国総科 小泉晴比古、橘 勝、小島謙一*

宇宙研 吉崎 泉

Analysis of dislocation images in X-ray topography of protein crystals

Haruhiko Koizumi, Masaru Tachibana, I. Yoshizaki[§] and Kenichi Kojima* International Graduate School of Arts and Sciences, Yokohama City University, 22-2 Seto, Kanazawa-ku, Yokohama 236-0027, Japan

⁸Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), 2-1-1 Sengen, Tsukuba, Ibaraki, 305-8505, Japan *E-Mail: kojima@yokohama-cu.ac.jp

Abstract: Dislocation images in X-ray topography of protein crystals such as tetragonal hen egg-white lysozyme crystals were analyzed. Not only extinction but also double contrast of dislocation images is observed on the X-ray topographs.

Key words; X-ray topography, Lysozyme crystals, dislocations

1. はじめに

X 線トポグラフィは結晶内の転位のキャラクタリ ゼーションを行う上で非常に強力な手法の一つで ある。タンパク質結晶への X 線トポグラフィの応 用は様々なグループによって行われている。しかし ながら、そのほとんどのタンパク質結晶のトポグラ フ像は低分子有機結晶に比べ不明瞭であった。

最近、単色 X 線を用いた位相敏感トポグラフィ により、正方晶リゾチームと立方晶フェリチンの干 渉縞が得られた^{1),2)}。さらに、大型正方晶リゾチー ムにおいて、放射光白色 X 線トポグラフィにより 線状のコントラストも得られている^{3),4)}。後者の研 究では、回折ベクトルに依存した線状コントラスト の消滅が観察された。線状コントラストの消滅は、 それらが転位像であるという証明でもある。しかし ながら、タンパク質結晶内の転位像の解釈はまだ不 十分である。本稿では、以前報告した正方晶リゾチ ームの X 線トポグラフィにおける転位像の更に詳 細な解析を報告する⁵⁾。

2. 実験方法

正方晶リゾチームの育成方法には塩濃度勾配法が 用いられ、室温で2週間静置することにより4mm 程度の結晶が育成された。育成された結晶は{110} と{101}の晶癖面をもっている。X線トポグラフィ によって明瞭な転位像を観察するために、厚さ1.5 mm 以上の大型結晶が実験に使われた⁴⁾。

X 線トポグラフィは KEK・PF の BL15B1 と SPring-8のBL28B2における白色X線を用いて行わ れた⁶⁾。X 線トポグラフィ実験についての詳細は以 前報告した論文に書かれている⁴⁾。また、入射 X 線は正方晶リゾチームの[001]方向にほとんど平行 に入射された。

X線トポグラフ上の転位像の解析のために、正方

晶リゾチームにおいてロッキング・カーブの測定も KEK・PFのBL10Aにおいて行われた。測定に用い た波長は1.542Åである。ロッキング・カーブの測 定方法は、以前報告された佐藤らと同様である⁷⁾。 また、測定されたロッキング・カーブの半値幅 (FWHM)は Gaussian 関数によりフィッティング された。

3. 結果と考察

Fig.1に放射光白色X線により撮影された正方晶リ ゾチームのトポグラフ像を示す。Fig. 1a, b および c のトポグラフ像はそれぞれ 080、440 および 12120 反射である。Fig. 1a に見られるように、結晶の中 心から線状のコントラストがはっきりと観察され る。それらは[110]方向と[110]方向にほとんど平行 である。Fig. 1aの[110]方向に平行な線状のコント ラストは、Fig. 1bの440反射において消滅している。 一方、Fig. 1aの[110]方向に平行な線状のコントラ ストはFig.1cの12120反射において消滅している。 そのような線状コントラストの消滅は、それらが転 位像であることの一つの証拠である。また、転位の 消滅則であるg・b=0に従うと、Fig.1の[110]方向 と[110]方向に平行な転位のバーガース・ベクトル はそれぞれ[110]方向と[110]方向であると決定され る。ゆえに、正方晶リゾチームにおいて支配的な転 位は<110>方向のバーガース・ベクトルをもったら せん転位である。

正方晶リゾチームの転位密度が得られたトポグ ラフ像の転位線の数から見積もられた。結果として、 転位密度はおおよそ 10² /cm² のオーダーであるこ とがわかった。この値は、良質な低分子有機結晶に おいて報告されている転位密度と同じぐらい低い 値である^{8).9)}。このため、育成された正方晶リゾチ ームは比較的低い転位密度である。



Fig. 1 Laue topographs of (a) 080, (b) 440, (c) 1212 0 reflections of tetragonal HEW lysozyme crystal.⁵⁾

トポグラフ像を詳しく見ていくと、各々の転位像 がダブルコントラストを形成していることがわか る。ダブルコントラストは時々転位像の重なりを導 き、個々の像の分解能を落とす。Fig.1の矢印によ って示されている転位像において、ダブルコントラ ストがはっきりと観察されている。Fig.2に拡大し たトポグラフ像を示す。

Fig. 2 に示すように、転位像は 080 反射において シングルコントラストを示し、440 反射においてダ ブルコントラストを示している。転位像の幅は 080 反射において<18 µm であり、440 反射において 50 µm である。転位のイメージ幅は反射面に強く依存 しており、これは X 線トポグラフ上の一本の転位 線における主な特徴の一つである。このため、観察



100 µ m

Fig. 2 Enlarged topographs showing (a) single contrast and (b) double contrast of the dislocation image, respectively, observed in (a) 080 and (b) 440 reflections in Fig. 1. $^{5)}$

されたダブルコントラストはバンドル状の転位で はなく、一本の転位に由来する。

X 線トポグラフィにおける転位のダブルコント ラストは Authier によって直接像として説明されて いる^{10,11}。直接像は、実効的な方位ずれ|δ|を超えた qωの領域において生じる。q は1 から 2 の間の定 数であり、ω は完全結晶の半値幅(FWHM)であ る。対称ラウエケースにおいて、ω は以下のように 表わせられる。

$$\omega = \frac{2r_e}{\sin 2\theta} \frac{\lambda^2 |F|}{\pi V}$$
(1)

ここで、 θ はブラック角で、 r_e は古典的な電子の半径、 λ は X 線の波長、F は構造因子、V はユニット セルの体積である。よって、直接像を形成する領域 は以下のような式において定義された領域によっ て制限される。

$$|\delta| = q\omega \tag{2}$$

このため、らせん転位のダブルコントラストのイメ ージ幅である D は次のような式によって表わせら れる。

$$D = \frac{b_s}{2\pi} \frac{1}{q\omega} \tag{3}$$

ここで、 b_g はバーガース・ベクトル bにおける回 折ベクトル gに平行な成分である⁸⁾。

バーガース・ベクトル b = [110]をもったらせん転 位のダブルコントラストのイメージ幅Dが、q=1として式(1)、(3)から計算された。080 反射と440 反 射における計算値が、観察値と共に Table 1 に示さ れている。計算されたイメージ幅はそれぞれ 080 反射において 2.68×10³ µm であり、440 反射におい て 3.54×10³ μm である。一方、観察されたイメージ 幅はそれぞれ 080 反射において<18 µm であり、440 反射において 50 µm である。計算値および観察値 の両方において、440反射のイメージ幅は080反射 のイメージ幅よりも大きいが、計算値が、観察値 よりも非常に大きいことに注目すべきである。計 算値はミリメーターのオーダーであるのに対し、 観察値はマイクロメーターのオーダーである。つ まり、イメージ幅の計算値は観察値のオーダーよ りも二桁大きいのである。

ここで、正方晶リゾチームの X`線トポグラフ上 の転位コントラストのイメージ幅の計算値と観察 値との大きな矛盾の起源について考えよう。以前 報告された無機結晶¹¹⁾や低分子有機結晶⁸⁾のダブ ルコントラストの解析に従うと、トポグラフ上で 観察されたイメージ幅は計算値と非常によく一致 する。それらの場合、測定されたロッキング・カー ブの半値幅は、式(1)を用いて計算された完全結晶 の値と非常によく一致する¹²⁾。一方、タンパク質 結晶においては、ユニットセルの体積が非常に大き いため、式(1)を用いて計算された完全結晶のロッ キング・カーブの半値幅は、無機結晶や低分子有機 結晶のそれよりも非常に小さい¹²⁾。この研究で育 成された正方晶リゾチームにおいて、測定されたロ ッキング・カーブの半値幅は、Fig.3に示してある ように、それぞれ 080 反射において 4.09×10⁻³ °であ



Fig. 3 Rocking curve profiles of (a) 080 and (b) 440 reflections in tetragonal HEW lysozyme crystal.⁵⁾

り、440 反射において 4.57×10⁻³ °である。これらの 値は、これまで報告されていた非常に結晶性の良い 正方晶リゾチームの値と同等である^{2),13),14)}。しかし ながら、これらの値でさえ式(1)を用いて計算され た完全結晶の値と比較すると非常に大きい。これは、 育成された正方晶リゾチームが完全性の良い低分 子有機結晶と同程度の転位密度しかもっていない にもかかわらず、結晶性が悪いということを意味し ている。これは、タンパク質結晶の興味深い特性で ある。タンパク質結晶のこの結晶性の悪さは、タン パク質結晶内に含まれる多量の水分子が関与する、

Table 1 Comparison of calculated and observed values of the image width *D* of a screw dislocation with Burgers vector $\boldsymbol{b} = [110]$ (111.9 Å) in X-ray topographs with 080 and 440 reflections of tetragonal HEW lysozyme crystals as shown in Fig. 2. Here, b_g is the component parallel to the diffraction vector \boldsymbol{g} in the Burgers vector \boldsymbol{b} , θ is the Bragg angle, λ is the wavelength employed, *F* is the structure factor, *V* is the volume of unit cell, and ω is the FWHM of the rocking curve of the perfect crystal.

							<i>D</i> (µm)	
Reflection	$b_{g}(\mathrm{\AA})$	θ (°)	$\lambda(\text{\AA})$	F	$V(\text{\AA}^3)$	ω (°)	Calculatio	Observatio
							n	n
080	79.1	5.20	1.79	695	2.37×10^{5}	5.37×10^{-5}	2.68×10^{3}	<18
440	111.9	1.54	0.75	1259	2.37×10^{5}	5.76×10^{-5}	3.54×10^{3}	50

転位以外の他の結晶欠陥に由来するものと考えられる。このため、高いモザイシティーをもつタンパク質結晶のイメージ幅の解析において、式(1)を用いて計算された完全結晶のロッキング・カーブの半値幅を用いることは疑問である。

上で述べたように、正方晶リゾチームにおける式 (1)を用いて計算された完全結晶の半値幅は測定値 よりも二桁小さい。この矛盾は Table 1 に示してあ るように、転位コントラストのイメージ幅の矛盾と 同じオーダーである。もし、式(3)の ω に測定され た半値幅を代入すれば、計算されたイメージ幅は観 察値と一致する。これは、転位コントラストの観察 されたイメージ幅は、主に、タンパク質結晶の完全 性の悪さによるということを示している。つまり、 タンパク質結晶の完全性が悪くなればなるほど、観 察される転位コントラストのイメージ幅は小さく なるのである。このため、タンパク質結晶のモザイ シティーの度合いは X 線トポグラフ上で観察され る転位コントラストのイメージ幅から見積もるこ とができることを示唆している。

4. 結論

我々は、X 線トポグラフィにおいて一本の転位のダ ブルコントラストが正方晶リゾチームのようなタ ンパク質結晶においても明瞭に観察されることを 示した。そして、観察された転位コントラストのイ メージ幅は運動学的回折理論をもとに計算された 値よりも非常に小さいことがわかった。さらに、運 動学的回折理論により見積もられた完全結晶のロ ッキング・カーブの半値幅は、測定された値よりも 二桁小さいこともわかった。この矛盾は転位コント ラストのイメージ幅の矛盾と一致する。この相関か ら、半値幅の広がり、つまり、完全性の悪さが、育 成された結晶において観察されるイメージ幅に影 響を与えるということを示唆している。

参照文献

- Z.E. Hu, B. Lai, Y.S. Chu, Z. Cai, D.C. Mancini, B.R. Thomas and A.A. Chernov, *Phys. Rev. Lett.* 87 148101-1 (2001).
- Z.W. Hu, Y.S. Chu, B. Lai, B.R. Tomas and A.A. Chernov, *Acta Cryst.* D60 621 (2004).
- K. Izumi, K. Taguchi, Y. Kobayashi, M. Tachibana, K. Kojima and M. Ataka, J. Cryst. Growth 206 155 (1999).
- 4) M. Tachibana, H. Koizumi and K. Kojima, J. Synchrotron Rad. 10 416 (2003).
- H. Koizumi, M. Tachibana and K. Kojima *Phil.* Mag. 85, 3709 (2005).
- 6) M. Tachibana and K. Kojima, *Curr. Top. Cryst. Growth Res.* 6 35 (2002).

- 7) T. Sato, Y. Yamada, S. Saijo, T. Hori, R. Hirose, N. Tanaka, G. Sazaki, K. Nakajima, N. Igarashi, M. Tanaka and Y. Matsuura, *Acta Cryst.* **D56** 1079 (2000).
- 8) H. Klapper, *Crystals*, **Vol. 13**, edited by H. C. Freyhardt (Springer, Berlin, 1991), pp. 109.
- J.N. Sherwood, *Defect Control in Semiconductors*, edited by K. Sumino (North-Holland, Amsterdam, 1990), pp. 1611.
- 10) A. Authier, *Dynamical Theory of X-Ray Diffraction* (Oxford, Oxford, 2004).
- 11) A. Authier, Adv. X-ray Anal. 10 9 (1967).
- 12) J.R. Helliwell, J. Cryst. Growth 90 259 (1988).
- E.H. Snell, S. Weisgerber, J.R. Helliwell, E. Weckert, K. Holzer and K. Schroer, *Acta Cryst.* D51 1099 (1995).
- 14) D. Lübbert, A. Meents and E. Weckert, *Acta Cryst.* D60 987 (2004).